

2018  
3/13

**ANCF**  
AIST Nanocharacterization

産総研

微細構造解析プラットフォーム  
陽電子プローブと機能材料

# 設備利用講習会に 参加してみよう!

主催：産総研 微細構造解析プラットフォーム 先端ナノ計測施設：ANCF

場所：産業技術総合研究所つくば第2事業所 2-12棟2階第6会議室

日時：平成30年3月13日(火) 13:30~17:00

参加費：無料(懇親会：17:30~ 3,000円) ※懇親会にも参加してね!



平成 29年度第 1 回産総研微細構造解析プラットフォーム設備利用講習会

陽電子プローブと機能材料および関連課題

原子サイズの微小空隙(欠陥)は、材料特性に影響を与えるため、材料開発時の評価が重要です。電子の反粒子である陽電子を利用して、金属・半導体・高分子材料等の様々な材料中の原子サイズの微小空隙(欠陥)を評価することができます。

産総研では、陽電子プローブマイクロプローブアナライザを大学・研究機関や企業の方々にご利用いただくため、ナノテクノロジープラットフォーム事業等にて公開しています。本講習会では、ナノ空孔材料など機能材料への応用に関連して、陽電子を用いた材料分析についての基礎から応用までを紹介し、かつ装置を御見学いただきます。

主催：産総研 微細構造解析プラットフォーム（先端ナノ計測施設：ANCF）

日時：平成30年3月13日（火）13時30分～17時00分

場所：産業技術総合研究所 つくば第2事業所 2-12棟 2階第 6会議室

参加費：無料（懇親会：3,000円）

## プログラム

13:30-13:35	開会の挨拶	産総研	分析計測標準研究部門	研究部門長	野中秀彦
13:35-14:15					
14:15-14:45					
14:45-15:00	休憩				
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:05	閉会の挨拶	産総研	分析計測標準研究部門	首席研究員	鈴木良一
16:05-16:20	休憩及び移動				
16:20-17:00	産総研陽電子施設見学				

研究会終了後(17:30-)産総研内カフェ・ピクニックにて懇親会を行います。

皆様の参加をお待ちしております。（懇親会会費 3,000円）

### 【参加申込について】

事前に申込みをお願いいたします。

氏名、所属名（会社名）、部署名、連絡先（E-mail、電話番号）を下記事務局あてにお送りください。

講演会のみ当日の参加申込みも可能ですが、懇親会の参加申込みは準備の都合上、**3月5日(月)**までをお願いいたします。

◆参加申込み・お問合せ：分析計測標準研究部門 X線・陽電子計測研究グループ  
E-mail: [y-kobayashi@aist.go.jp](mailto:y-kobayashi@aist.go.jp) 電話：029-861-5203,4886